

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/055475 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01B 11/03, 5/008, 21/04

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/014252

(22) Internationales Anmeldedatum: 15. Dezember 2003 (15.12.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 58 685.3 13. Dezember 2002 (13.12.2002) DE
103 15 990.8 7. April 2003 (07.04.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): WERTH MESSTECHNIK GMBH [DE/DE]; Siemensstrasse 19, 35394 Giessen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CHRISTOPH, Ralf [DE/DE]; Siemensstrasse 19, 35394 Giessen (DE). MÜLLER, Klaus [DE/DE]; Hiltrops Kamp 15, 45276 Essen (DE). RAUH, Wolfgang [DE/DE]; Vogtlandstrasse 58, 71111 Waldenbuch (DE).

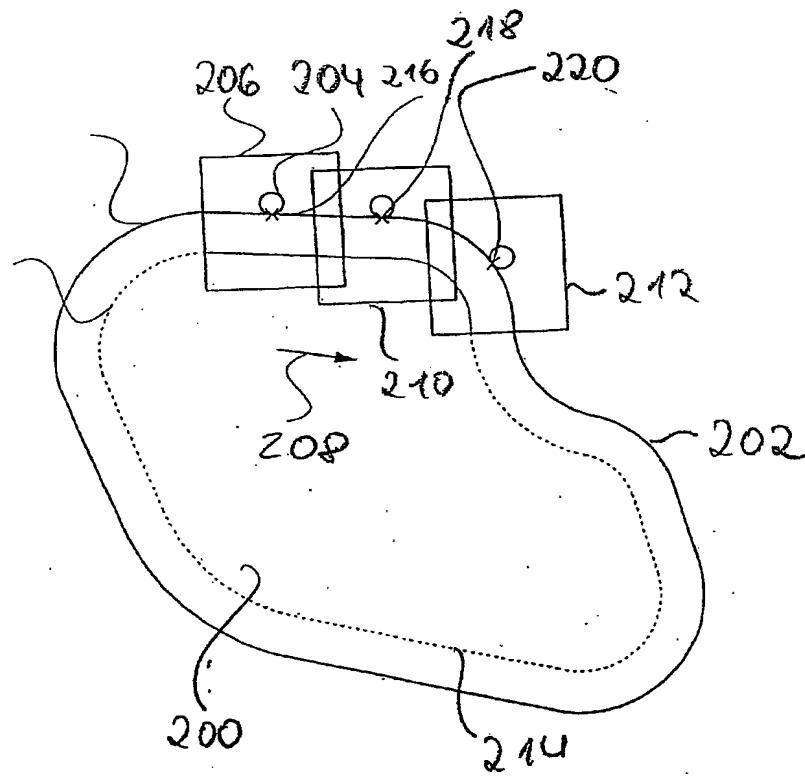
(74) Anwalt: STOFFREGEN, Hans-Herbert; Friedrich-Ebert-Anlage 11b, 63450 Hanau (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR MEASURING A CONTOUR OF A WORKPIECE BY SCANNING

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM SCANNENDEN MESSEN EINER KONTUR EINES WERKSTÜCKS



(57) **Abstract:** The invention relates to a method for measuring a contour of a workpiece by scanning, using a first and a second sensor. According to the invention, the contour of the workpiece may be measured with high precision and rapidly, especially in the edge region thereof, whereby the contour of the workpiece is recorded by means of the at least two sensors and the information obtained from at least one sensor is used to influence the actions of at least one other sensor.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum scannenden Messen einer Kontur eines Werkstücks, unter Verwendung eines ersten und eines zweiten Sensors. Um mit hoher Präzision und Geschwindigkeit die Kontur des Werkstücks insbesondere auch im Flankenbereich messen zu können, wird vorgeschlagen, dass die Kontur des Werkstücks mit Hilfe von den zumindest zwei Sensoren erfasst wird und dass gewonnene Informationen mindestens eines Sensors zur Beeinflussung mindestens eines anderen Sensors in seinen Aktionen benutzt werden.

WO 2004/055475 A2